

1. Record Nr.	UNINA9910826387303321
Autore	Riboldi Franco
Titolo	Stop a la adiccion al tabaco : una guia para dejar de fumar // Franco Riboldi ; [Traduccion de Cristina Sala]
Pubbl/distr/stampa	Barcelona, : De Vecchi Ediciones, 2012
Edizione	[1st ed.]
Descrizione fisica	191 p
Altri autori (Persone)	SalaCristina
Disciplina	613.85
Soggetti	Smoking Smoking cessation
Lingua di pubblicazione	Spagnolo
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.
Nota di contenuto	Intro -- Titolo -- Introduccion -- ¿Por que una guia? -- Aspectos innovadores -- Etapas del proceso -- Como se utiliza -- PRIMERA ETAPA: planificacion -- Punto de partida: el principe infeliz -- Primer paso: analice su dependencia -- ¿POR QUE FUMA? -- ¿QUE METODO UTILIZAR? -- Segundo paso: desarrolle sus recursos -- AUTOCONVENCIMIENTO -- VISUALIZACION MENTAL -- Tercer paso: utilice nuevas estrategias -- EL GRAN CASTILLO -- SEGUNDA ETAPA: el problema -- Punto de partida: la oveja descarriada -- Primer paso: analice su dependencia -- ¿COMO FUNCIONA LA TRAMPA? -- ME GUSTA FUMAR -- FUMAR ME RELAJA -- FUMAR ME AYUDA -- ES MAS FUERTE QUE YO -- ¿CUAL ES LA MAGNITUD DEL PROBLEMA? -- Segundo paso: desarrolle sus recursos -- CONTROL DE LAS EMOCIONES -- PENSAMIENTO POSITIVO -- Tercer paso: utilice nuevas estrategias -- EL BOSQUE MISTERIOSO -- TERCERA ETAPA: motivacion -- Punto de partida: la estatua parlante -- Primer paso: analice su dependencia -- ¿POR QUE QUIERE DEJARLO? -- ¿QUE FACTORES INFLUYEN SOBRE LA MOTIVACION? -- Segundo paso: desarrolle sus recursos -- LOS MENSAJES DEL INCONSCIENTE -- AUTOSUGESTION -- Tercer paso: utilice nuevas estrategias -- LA BARRERA INVISIBLE -- CUARTA ETAPA: decision -- Punto de partida: la estrella fugaz -- Primer paso: analice su dependencia -- ¿QUE INTERFIERE EN LA DECISION? -- EL RIESGO DE NO DECIDIR -- Segundo paso: desarrolle sus recursos -- VALORES Y FUERZA DE VOLUNTAD --

AUTOOBSERVACION -- Tercer paso: utilice nuevas estrategias -- LA ENCRUCIJADA DE LA DUDA -- QUINTA ETAPA: deshabitacion -- Punto de partida: el guardian del faro -- Primer paso: analice su dependencia -- ¿QUE PROBLEMAS SE MANIFIESTAN AL DESHABITUARSE DEL TABACO? -- COMO ABANDONAR EL CIGARRILLO -- FORMAS DE ACTUACION -- Segundo paso: desarrolle sus recursos -- EL ARTE DE LA DISTRACCION -- LA RELAJACION MUSCULAR. Tercer paso: utilice nuevas estrategias -- LA ISLA DEL TESORO -- SEXTA ETAPA: cambio -- Punto de partida: el patito feo -- Primer paso: analice su dependencia -- ¿ACABA TODO CON EL ULTIMO CIGARRILLO? -- ¿QUE ACTITUD FAVORECE EL CAMBIO? -- Segundo paso: desarrolle sus recursos -- CALMA Y AUTOCONTROL -- LA EDUCACION SENSORIAL -- Tercer paso: utilice nuevas estrategias -- LA LLAMADA DE LA NATURALEZA -- Al final del camino -- ¿Por que no consigo dejarlo? -- ¿Que puedo hacer para no recaer? -- ¿Y si me ofrecen un cigarrillo? -- Bibliografia.

---

#### Sommario/riassunto

¿Fumar?, ¿por que?, ¿para que? ¡Miles de personas fallecen cada ano por su adiccion al tabaco! ¡Recupere el placer de no fumar! Abandonar la adiccion es el objetivo a conseguir, debido a que esto lleva implicito la recuperacion de la salud, ademas de otras muchas cosas. En estas paginas le ofrecemos mecanismos sencillos para que lo consiga solo con el esfuerzo estrictamente necesario. No le marearemos con tecnicas y consejos, sino que le ofrecemos los recursos concretos para que recupere aquello que el tabaco parece haberle arrebatado inexorablemente: respeto por uno mismo, autoestima, autonomia, autocontrol y, no en ultimo lugar, sentido del placer (el verdadero). Esta guia sigue un recorrido articulado en tres pasos para aproximarse al problema: analice su dependencia, desarrolle sus recursos y utilice nuevas estrategias. Asi, le llevara hasta el objetivo final en una serie de etapas estudiadas para que llegue a su meta a traves del logro de objetivos intermedios. Para ello, se concentra, por un lado, en los aspectos menos conflictivos en el plano psicologico, atenuando las dudas e indecisiones, y, por otro, se favorece la consecucion de determinados retos que animan constantemente el proceso de recuperacion.

---

2. Record Nr.	UNINA9910808037403321
Autore	Ker Ming-Dou
Titolo	Transient-induced latchup in CMOS integrated circuits / / Ming-Dou Ker and Sheng-Fu Hsu
Pubbl/distr/stampa	Singapore ; ; Hoboken, NJ, : Wiley, c2009
ISBN	9786612382185 9781282382183 1282382187 9780470824092 0470824093 9780470824085 0470824085
Edizione	[1st ed.]
Descrizione fisica	1 online resource (265 p.)
Altri autori (Persone)	HsuSheng-Fu
Disciplina	621.3815 621.39/5
Soggetti	Metal oxide semiconductors, Complementary - Defects Metal oxide semiconductors, Complementary - Reliability
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.
Nota di contenuto	Physical Mechanism of TLU under the System-Level ESD Test -- Component-Level Measurement for TLU under System-Level ESD Considerations -- TLU Dependency on Power-Pin Damping Frequency and Damping Factor in CMOS Integrated Circuits -- TLU in CMOS ICs in the Electrical Fast Transient Test -- Methodology on Extracting Compact Layout Rules for Latchup Prevention -- Special Layout Issues for Latchup Prevention -- TLU Prevention in Power-Rail ESD Clamp Circuits -- Appendix A: Practical Application Extractions of Latchup Design Rules in a 0.18-mm 1.8 V/3.3V Silicided CMOS Process.
Sommario/riassunto	"Transient-Induced Latchup in CMOS Integrated Circuits equips the practicing engineer with all the tools needed to address this regularly occurring problem while becoming more proficient at IC layout. Ker and Hsu introduce the phenomenon and basic physical mechanism of latchup, explaining the critical issues that have resurfaced for CMOS

technologies. Once readers can gain an understanding of the standard practices for TLU, Ker and Hsu discuss the physical mechanism of TLU under a system-level ESD test, while introducing an efficient component-level TLU measurement setup. The authors then present experimental methodologies to extract safe and area-efficient compact layout rules for latchup prevention, including layout rules for I/O cells, internal circuits, and between I/O and internal circuits. The book concludes with an appendix giving a practical example of extracting layout rules and guidelines for latchup prevention in a 0.18-micrometer 1.8V/3.3V silicided CMOS process."--Publisher's description.

---